

電源システムの品質を支える測定、検査および解析技術

日時 2010年12月10日(金) 13:00～17:00
会場 機械振興会館・地下3階 研修1号室
主催 (社)電子情報通信学会
電子通信エネルギー技術研究専門委員会(委員長 石原 好之)
共催 IEEE Power Electronics Society Japan Chapter

講演題目

1. 半導体の検査、解析技術
真島敏幸(ルネサスエレクトロニクス) 1
2. 電源設計に活用できる最新回路・磁気シミュレーション技術
堀内智哉(アンシス・ジャパン) 11
3. 蓄電池診断装置
長嶋 茂(古河電池) 22
4. 設備における電源品質計測と解析
竹内勝広(日置電機) 29
5. スマートメーターとHANの技術動向
水城官和(Wireless Glue Networks Inc.) 38
正田博之(日本テキサス・インスツルメンツ) 44